分析電子顕微鏡でのホウ素化合物の EDS 元素分析

塩見 正樹* 中山 享**

EDS elemental analysis of boron compounds by analytical electron microscopy

Masaki SHIOMI* Susumu NAKAYAMA**

A scanning electron microscope (SEM-EDS) equipped with an energy dispersive X-ray spectrometer irradiates a minute region on the surface of sample with an electron beam, and performs precise elemental analysis using characteristic X-rays generated from the irradiated volume. However, boron, an ultralight element with a particularly large X-ray absorption coefficient, is affected by coexisting elements. Therefore, the quantitativeness of the elemental analysis of the boron-containing compound is lowered. We investigated the difference in boron element information obtained by SEM-EDS using commercially available boron compounds. In order to improve the quantification, it is necessary to adjust the acceleration voltage depending on whether the coexisting element is a light element or a heavy element.

1. 緒 言

ホウ素 (B) を含むホウ酸ガラス (Na₂O-B₂O₃系) やホウケ イ酸ガラス (Na₂O-B₂O₃-SiO₂ 系) の組織観察および組成決定 にはエネルギー分散型X線分析装置が付属した走査電子顕微 鏡 (SEM-EDS: Scanning Electron Microscope - Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) がよく用いられる。電子線を固体試料表 面の微小領域(~2 μm)に照射し、照射体積から生ずる特性 X線を測定することで、精密な化学分析を行う装置である。 しかしながら、X 線吸収係数が特に大きなBは共存元素によ って左右される。Bを含むC、N、Oなどの超軽元素はX線 吸収係数が大きいため、加速電圧を上げていくと X 線の発 生部が深くなるため X 線の吸収による影響が大きくなる。し たがって、加速電圧を上げると検出強度が下がることがあり、 10 kV またはそれ以下の条件で最大検出強度となることが多 い。超軽元素の X 線吸収係数は、重元素との化合物中よりも 軽元素との化合物中で大きい場合が多く、軽元素を含む化合 物中で検出し難い傾向にある。B については、軽元素中で重 元素中より X 線吸収係数が10倍以上大きい場合がある。そ のため、重金属合金化合物中よりもケイ酸塩ガラス中で吸収

が大きくなり、加速電圧を高くすると検出強度が低下し測定 強度のバラつきが大きくなることが知られている「U。そこで、 本報告では市販のいくつかの B 含有物質について SEM-EDS 測定・解析を行い、得られた元素分析情報の違いを調べた。

2. 実 験

2-1 試薬

炭化四ホウ素 (B_4C) 、純度: 2N)、窒化ホウ素 (BN)、純度: 2N)、三酸化二ほう素 (B_2O_3) 、純度: 3N)、ヘプタオキソ四ホウ酸カルシウム六水和物 $(CaB_4O_7\cdot 6H_2O)$ 、純度: 2N)、二メタほう酸バリウム $(Ba(BO_2)_2)$ 、純度: 2N)、二メタほう酸バリウム $(Ba(BO_2)_2)$ 、純度: 98%)、は、三津和化学薬品株式会社のものを用いた。ホウ酸 (H_3BO_3) 、試薬特級)、四ほう酸ナトリウム十水和物 $(Na_2B_4O_7\cdot 10H_2O)$ 、試薬特級)は、富士フィルム和光純薬株式会社のものを用いた。

2-2 分析方法

元素分析は、電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM、日本電子株式会社、 JSM-JSM-7500F) に 取り付けられているエネ

令和5年8月24日受付 (Received Aug. 24, 2023)

^{*}新居浜工業高等専門学校エンジニアリングデザイン教育センター (Center for Engineering Design Education, National Institute of Technology (KOSEN), Niihama College, Niihama, 792-8580, Japan)

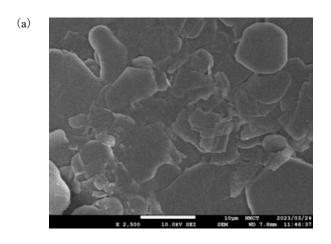
^{***}新居浜工業高等専門学校生物応用化学科(Department of Applied Chemistry and Biotechnology, National Institute of Technology (KOSEN), Niihama College, Niihama, 792-8580, Japan)

ルギー分散型 X 線解析装置 (EDS、日本電子株式会社 JED-2300) を用いて、倍率 2500 にて面分析で行った。加速電圧は、3.1、4、5、7、10、15、20 kV の 7 種類を用いた。

3. 結果及び考察

3-1 ホウ素元素の加速電圧と特性 X 線ピーク強度の関係

ホウ素 (B) と同じ超軽元素 (C、N、O) とのホウ素化合物として、炭化四ホウ素 B4C、窒化ホウ素 BN、酸化ホウ素 B2O3、ホウ酸 H_3BO3 の 4 種類を選び、7 種類の加速電圧と Bピーク強度の関係を調べた。 Fig.1 に、加速電圧 10 kV で観察・測定した BN の SEM 像および EDS チャートを示す。EDS チャートには、0.18 kV に Bの K α 線ピークが、0.39 kV に Nの K α 線ピークが観測される。同様に観察・測定した結果を、 Table 1 にまとめた。 X 線吸収係数が大きい B など超軽元素は加速電圧を上げると特性 X 線の発生領域が深くなり、吸収による影響が非常に大きくなることが知られている。このため、加速電圧を上げると検出強度が下がることが予想される。本報告では、 B_4 C、 B_1 N、 B_2 O3、 H_3 BO3 共に加速電圧 10 kV で最大の B ピーク強度が得られた。



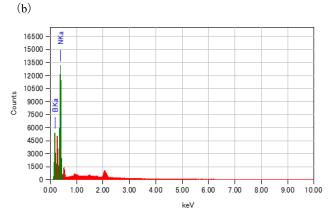
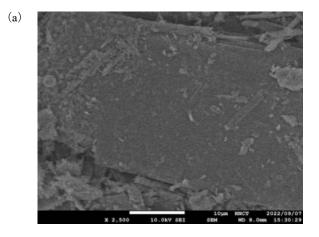


Fig.1 加速電圧 10 kV にて観察・測定した BN の (a) SEM 像および (b) EDS チャート.

Table 1 炭素、窒素、酸素とのホウ素化合物の加速電圧と B ピーク強度の関係

	B ₄ C	BN	B_2O_3	H_3BO_3
3.1 kV	1112	1805	312	844
4 kV	1634	2898	522	1186
5 kV	2891	3673	674	1422
7 kV	5035	4869	833	2028
10 kV	6934	5403	897	2769
15 kV	3940	2259	542	1472
20 kV	2963	1517	431	1147

次に、超軽元素より原子量の大きな Na、Ca、Cu、BaとBとのホウ素化合物として、四ほう酸ナトリウム十水和物 Na₂B₄O₇·10H₂O、ヘプタオキソ四ホウ酸 CuB₄O₇、二メタほう酸バリウム Ba(BO₂)₂の 4種類を選び、加速電圧とBピーク強度の関係を調べた。Fig.2 および Fig.3、加速電圧 10 kVで観察・測定した CaB₄O₇·6H₂O および Ba(BO₂)₂の SEM 像とEDS チャートを示す。EDS チャートには、0.18 kV にBの Ka線ピークが、3.69 kV に Caの Ka線ピークが観測される。同様に観察・測定した結果を、Table 2 にまとめた。超軽元素(C、N、O)より原子量の大きな Na、Ca、Cu、BaとBからなるホウ素化合物の場合でも B₄C、BN、B₂O₃、H₃BO₃と同じく、Na₂B₄O₇·10H₂O、CaB₄O₇·6H₂O、CuB₄O₇、Ba(BO₂)₂ 共に加速電



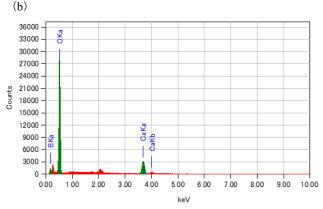
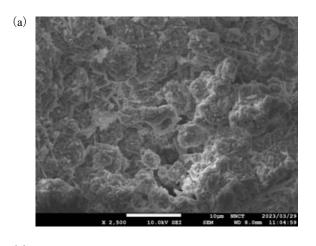


Fig.2 加速電圧 10 kV にて観察・測定した CaB₄O₇·6H₂O の (a) SEM 像および (b) EDS チャート.



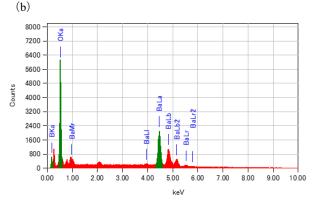


Fig.3 加速電圧 10~kV にて観察・測定した $Ba(BO_2)_2$ の (a) SEM 像および (b) EDS チャート.

Table 2 ナトリウム、カルシウム、銅、バリウムとのホウ素 化合物の加速電圧と B ピーク強度の関係

	Na ₂ B ₄ O ₇	CaB ₄ O ₇	CuB ₄ O ₇	Ba(BO ₂) ₂
3.1 kV	533	563	258	198
4 kV	741	835	374	205
5 kV	945	1000	423	310
7 kV	935	1392	560	460
10 kV	948	1394	685	622
15 kV	360	640	347	331
20 kV	227	518	231	293

圧 $10\,\mathrm{kV}$ で最大の B ピーク強度が得られた。ホウ素化合物中の B の特性 X 線ピーク強度は、ホウ素化合物を形成する他の元素の違い(原子量の違い)に関係なく、加速電圧 $10\,\mathrm{kV}$ で最も強い強度が得られることがわかった。

3-2 ホウ素以外元素の加速電圧と特性 X 線ピーク強度の 関係

 B_4C 、BN、 B_2O_3 、 H_3BO_3 について、加速電圧とB以外の元素 (Na、Ca、Cu、Ba) ピーク強度の関係を調べた。その結果を、Table 4 にまとめた。C、N、O もB と同じ超軽元素のため、X 線吸収係数が大きく、加速電圧を上げると特性 X 線の発生領域が深くなり、吸収による影響が非常に大きくなる。3-1 で述べた B ピーク強度の結果と同様に、 B_4C 、BN、 B_2O_3 、

H₃BO₃ で測定される C、N、O ピーク強度もすべて加速電圧 10 kV で最大のピーク強度が得られた。

Table 3 炭素、窒素、酸素とのホウ素化合物の加速電圧と B 以外の C、N、O ピーク強度の関係

	B ₄ C	BN	B_2O_3	H ₃ BO ₃
	С	N	О	О
3.1 kV	497	3691	3705	7933
4 kV	693	5913	6504	10955
5 kV	922	8275	9637	14537
7 kV	1052	11201	15669	26357
10 kV	1052	13171	24875	49856
15 kV	502	5806	16641	38174
20 kV	341	3883	15540	42657

次に、Na₂B₄O₇·10H₂O、CaB₄O₇·6H₂O、CuB₄O₇、Ba(BO₂)₂ に ついて、加速電圧とB以外の元素(Na、Ca、Cu、Ba)ピー ク強度の関係を調べた。その結果を、Table 4にまとめた。特 性 X 線の十分なピーク強度が得られる加速電圧の目安とし て、過電圧比(加速電圧/最小励起エネルギー)を約2以上 になるようにすることがよいとされている。Na、Ca は、超軽 元素 (B、C、N、O) と同じく、加速電圧 3.1~20 kV で Kα線 ピークを観測できる。しかしながら、原子量が大きな Cuは、 Kα線ピークは加速電圧 15kV 以上にしないと観測できない。 さらに原子量が大きな Ba は、Kα 線ピークは加速電圧 20 kV 以下では観測できない。Table 4に示すCuピーク強度は、3.1、 4、5、7、10 kV の加速電圧では Lα線、15、20 kV の加速電 圧では Kα線の値である。また、Baピーク強度は、すべて Lα 線の値である。Na (原子量 23) ピーク強度は、B₄C、BN、B₂O₃、 H₃BO₃で測定される B (原子量 11)、C (原子量 12)、N (原 子量 14)、O (原子量 16) ピーク強度と同様に加速電圧 10 kV で最大のピーク強度が得られた。一方、Ca (原子量 40) ピ 一ク強度は、加速電圧を上げるに従い高くなった。測定する 特性 X 線が Kα 線のみではないが、Cu (原子量 64) および Ba (原子量 137) ピーク強度も加速電圧を上げるに従い高く なった。しかしながら、Ca、Cu、Ba でも加速電圧 10 kV で 十分なピーク強度が観測できている。

Table 4 ナトリウム、カルシウム、銅、バリウムとのホウ素 化合物の加速電圧と B 以外の Na、Ca、Cu、Ba ピーク強度の 関係

	Na ₂ B ₄ O ₇	CaB ₄ O ₇	CuB ₄ O ₇	Ba(BO ₂) ₂
	Na	Ca	Cu ^{¾1}	Ba ^{**2}
3.1 kV	358	-	635	-
4 kV	775	-	1240	-
5 kV	1670	127	1764	-
7 kV	4248	932	3523	379
10 kV	9894	3120	5864	2084
15 kV	7627	4760	4101	3514
20 kV	6587	7660	3602	5313

**1 Cu ピーク強度 (CuB₄O₇) :

3.1~10 kV/Lα線、15~20 kV/Kα線

※2 Ba ピーク強度 (Ba(BO₂)₂) : 3.1~20 kV/Lα 線

上述の結果から、加速電圧を変更して各元素のピーク強度を確認することは重要であることがわかった。本報告で扱った8種類のホウ素化合物については、加速電圧10kVで測定することがよいと考えられる。この測定条件で、元素分析試料について既知組成物をいくつか用意することで定量分析が可能になると考えられる。

4. 結 言

エネルギー分散型 X 線分析装置が付属した走査電子顕微鏡 (SEM-EDS) は、試料表面の微小領域に電子線照射することで照射体積から生ずる特性 X 線によって精密な元素分析を行うができる。しかしながら、X 線吸収係数が特に大きな超軽元素のホウ素は共存元素によって左右される。そのため、ホウ素含有化合物の元素分析の定量性が低くなる。そこで、市販試薬のホウ素化合物を用いて SEM-EDS から得られるホウ素元素の情報の違いを調べた。定量性を上げるためには、共存元素が軽元素の場合と重元素の場合で加速電圧の調整する必要があることがわかった。

参考文献

[1] 「セラミックスのキャラクタリゼーション技術」、窯業協会会編集委員会講座小委員会編(窯業協会)pp.177-188 (1987).